

Patentansökning nr 0101374-7

ANSVARIG EF

Internationell klass (IPC)

G01N 021/89

Adressat:

ALBIHNS GÖTEBORG AB

BOX 142

401 22 GÖTEBORG SE

Sökande: Svante Björk AB, Magasinsgatan 5, 434 37 Kungsbacka SE.

Ombud: Albihns Göteborg AB. Ref: 112531.

Benämning: Förfarande och anordning för optisk avsyning.

B E S L U T

Er patentansökning har denna dag avslagits.

S K Ä L, se följande sida

Ö V E R K L A G A N D E

Vill Ni överklaga beslutet skall det göras skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till *Patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm*. I skrivelsen skall anges att avslagsbeslutet överklagas och lämnas en motivering till varför ändring i beslutet begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag. Ärendet kommer annars inte att prövas.

SKÄL

Föremål för beslutet är patentkraven 1-14 inkomna 2004-07-06, där krav 1 och 12 har justerats så att de tydligare beskriver uppfinningen.

Uppfinningen avser en anordning och ett förfarande för detektering av defekter i ett transparent material.

I föreläggandet daterat 2003-09-24 anfördes dokumentet

D1: SE 514 090 C2

D1 beskriver en anordning och metod för optisk avsyning med en scanner (6) (sid. 2, rad 11-sid. 6, rad 28) som är anordnad för detektering och mätning av defekter i ett transparent material (2) som avsynas. Avsyningen sker i successiva svep motsvarande ett flertal pixel hos scannern. När en punkt, som sänker ljustransmissionen tillräckligt, påträffas på materialet (2) sänds signaler till ett minne och en signalprocessor. Signaler från ett antal avsökningslinjer före triggerpunkten, från alla linjer så länge ljustransmissionen ligger under referensvärdet samt från ett antal avsökningslinjer efter det att ljustransmissionsnivån åter stigit över referensvärdet skickas till ett minne (10).

Sökanden har i sin svarsskrift daterad 2004-07-06 påpekat vissa skillnader mellan uppfinningen enligt patentkrav 1 och 12 och D1. Dessa bemöts nedan.

Enligt svarsskrivelsen från sökanden daterad 2004-07-06 visar inte D1 något separat rullande buffertminne i vilket lagras ett eller flera svep som föregår det svep vid vilket trigging detekteras. Det kan konstateras att det inte explicit står att ett separat buffertminne finns i D1. Däremot kan texten på sid. 6, rad 1-5:

När således en punkt uppträder på det transparenta materialet 2, som sänker ljustransmissionen tillräckligt sänds signaler från ett antal avsökningslinjer före triggerpunkten, från alla linjer så länge ljustransmissionen ligger under referensvärdet samt från ett antal avsökningslinjer efter det att ljustransmissionsnivån åter stigit över referensvärdet till buffert minnet 10 och signalprocessorn.

inte tolkas på något annat sätt än att det existerar ett minne som lagrar svep för att kunna skicka dessa svep från avsökningslinjer före triggerpunkten i de fall då en triggerpunkt påträffas till ett ytterligare minne. Att i den här situationen använda sig av ett rullande buffertminne är för en fackman självklart (se sid. 4, rad 26-rad 32 där det står att upp till 99% av alla pixeldata bortsorteras).

Vidare står det i svarsskriften (2004-07-06) att det i D1 inte framgår att signalerna som sänds till buffertminnet (10) innefattar information avseende ljustransmissionen hos svepen i fråga. För en fackman som läser D1 finns det ingen tvekan om vad för signaler som sänds till buffertminnet. Det står på ett flertal ställen i D1 att det är ljustransmissionen för varje pixel som mäts och i figur 1 visas bilder på uppmätta ljustransmissioner för olika områden på det transparenta materialet.

Enligt svarsskriften (2004-07-06) står det också att det i D1 inte finns något som anger att syftet med anordningen och förfarandet är att spara minnesbehov samt datorkraft.

Enligt D1 är ett av syftena med att använda sig av uppfinningen i D1, att upp till 99 % av alla pixeldata kan bortsorteras (sid. 4, rad 26-30) vilket medför måttliga minnesbehov och måttliga krav på datorkraft.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 beskriver att trigging sker i materialets tvärriktning genom att pixel för pixel jämföra med medelvärdet av tidigare svep utan detektering över tiden. Detta skiljer sig inte från vad som är beskrivet i D1, se sid. 3, rad 12-18 där det framgår att referensvärdet som används vid mätningarna bildas av medelvärdena på ett förutbestämt antal pixlar.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 och 12 är således ny men saknar uppfinningshöjd.

Jan Silfverling

/ Peter Hedman
Peter Hedman



Åsa Malm

Patentass.

JA A

Patentansökning nr 0101374-7
ANSVARIG ES
Internationell klass (IPC)
G01N 021/89

Adressat:

ALBIHNS GÖTEBORG AB
BOX 142
401 22 GÖTEBORG SE

Sökande: Svante Björk AB, Magasinsgatan 5, 434 37 Kungsbacka SE.

Ombud: Albihns Göteborg AB. Ref: 112531.

Benämning: Förfarande och anordning för optisk avsyning.

Skriftligt svar skall ha kommit in till PRV senast 2003-11-24.

- Om svar inte kommit inom angiven tid, avskrivs ansökningen (jfr 15 § patentlagen).
- Infaller angiven sista svarsdag på dag som är midsommarafton, julafton, nyårsafton, lördag eller helgdag anses svar ha kommit in i rätt tid om det inkommit till PRV påföljande vardag.

UPPLYSNINGAR

Har svar inkommit i rätt tid men anmärkt brist inte nöjaktigt undanröjts, kommer ansökningen att avgöras i befintligt skick om inte anledning finns att ge nytt föreläggande.

Patentkrav får inte ändras så att de kommer att innehålla något som inte framgår av grundhandlingarna. Ändras patentkrav så att nya bestämmelser tillkommer, ska samtidigt anges var motsvarighet finns i grundhandlingarna. Ändrade handlingar ska inges i två exemplar.

UTLÅTANDE, se följande sida

Utlåtande

Bedömning

Nyhet	Krav	1- 15	ja
	Krav		nej
Uppfinningshöjd	Krav		ja
	Krav	1- 15	nej
Industriell tillämpbarhet	Krav	1- 15	ja
	Krav		nej
Ej granskat	Krav	---	
Ej bedömt	Krav	---	

Med anledning av Ert svaromål daterat 2002-06-24 utfärdas härmed ett nytt föreläggande i ärendet.

Anförda dokument

D1: SE 514 090 C2

D2: SE 511 822 C2

Motivering

Dokument D1 anger en anordning och metod för optisk avsyning med en scanner (6) (sida 2, rad 11- sida 6, rad 28) som är anordnad för detektering och mätning av defekter i ett material (2) som avsynas. Avsyningen sker i successiva svep motsvarande ett flertal pixel hos scannern. Anordningen innefattar en datorenhet (14) med en minnesenhet, varvid datorenheten är inrättad för lagring av ett buffertminne (10). När en punkt uppträder på materialet (2), som sänker ljustransmissionen tillräckligt, sänds signaler till buffertminnet (10) och en signalprocessor (12). Signaler sänds från ett antal avsökningslinjer före punkten, från alla linjer så länge ljustransmissionen ligger under referensvärdet samt från ett antal avsökningslinjer efter det att transmissionsnivån åter stigit över referensvärdet. Se framförallt sida 6, rad 1- rad 5.

D2 anger en metod för att markera defekter. Defekterna och dess läge på ett material avläses genom en optisk metod. Defekternas position sparas och användes för utmärkning av defektens läge på materialet.

Patentkraven 1, 4, 6- 14

Dokument D1 anses representera teknikens ståndpunkt. Skillnaden mellan uppfinningen, enligt patentkraven 1, 4 samt 6- 14 och D1 är att avsökningslinjerna eller svepen lagras i

en *rullande buffert* att jämföras med D1 där avsökningslinjerna eller svepen lagras i ett *buffertminne*. Men ett buffertminne används för att tillfälligt lagra datamängder och att använda sig av ett buffertminne i form av en rullande buffert anses vara ett alternativ som är - om inte självklart för fackmannen, så åtminstone mycket närliggande för densamme. Uppfinningen enligt dessa krav är därmed ej patenterbar då uppfinningshöjd saknas.

Patentkraven 2- 3

Uppfinningen enligt patentkraven 2 och 3 skiljer sig i jämförelse med D1 genom att defektens läge utmärks på materialet. Problemet är att sortera materialet. Det är närliggande för fackmannen att använda markeringsmetoden i D2 på den optiska metoden i D1.

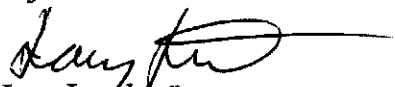
Patentkrav 5

Metoden enligt patentkrav 5 anger ett tillvägagångssätt närliggande för fackmannen.

Patentkrav 15

Anordningen enligt patentkrav 15 anger endast konstruktiva detaljutformningar närliggande för fackmannen.

I tjänsten



Lars Lundström

Tfn: 08- 782 28 46

Patentass.
itw